# 10 ナノ粒子及び機能性材料の解析技術開発(第2報) セリウム - ネオジウム酸化物の EELS 解析

田辺栄司,國府田由紀\*,住田弘祐\*,森下勇樹,本多正英

Microstructure of nano particles and functional materials (2nd Report) Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) of Cerium Neodymium Oxides

TANABE Eishi, KODA Yuki\*, SUMIDA Hirosuke\*, MORISHITA Yuuki, HONDA Masahide

Cerium oxide (CeO<sub>2</sub>) has been used in the automobile three-way catalyst because of the function to keep oxygen density. In this study, to clarify the structural change by composition and heat treatments of the cerium-neodymium oxides (Ce<sub>1-x</sub>Nd<sub>x</sub>O<sub>y</sub>), the microstructure and EELS spectra were investigated. Ce<sub>1-x</sub>Nd<sub>x</sub>O<sub>y</sub> (x= 0, 0.1, 0.3 and 0.5) were synthesized by coprecipitation reaction with Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> and Nd(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> as starting materials. After drying they were calcined in air at 600 for 2 h. Heat treatment condition was at 800 and 1,000 for 2h in air. It was confirmed that each crystal of image was cubic structure (a= $5.4 \sim 5.5$ ) by the selected area electron diffraction. The crystal size of CeO<sub>2</sub> is larger than that of Ce<sub>0.7</sub>Nd<sub>0.3</sub>O<sub>y</sub>. Crystal size of Ce<sub>0.7</sub>Nd<sub>0.3</sub>O<sub>y</sub> was increased by the heating. The EELS spectra of CeO<sub>2</sub> greatly changes by the heating, and the addition of the neodymium decreases the changes of EELS spectra by the heating.

キーワード: 3 元触媒,酸化セリウム,透過電子顕微鏡, EELS,制限視野電子回折

#### 1 緒 言

自動車用三元触媒は,有害な窒素酸化物の還元と炭化 水素および一酸化炭素の酸化を同時に行い,無害な窒素, 酸素および二酸化炭素に転化する機能を持つ。この機能 を維持するには,排ガス中の酸素濃度を一定に保つこと が重要となる。一般的に三元触媒のサポート剤として酸 化セリウムが使用されている。

 $CeO_2 CeO_{2-x} + x/2O_2$  (1)

これは,セリウムの酸化還元電位が 1.61eV と非常に 低いため,酸化セリウムは(1)の反応式の通り容易に 価数が変化し,リーン雰囲気では Ce<sup>4+</sup>となって酸素を貯 蔵し,リッチ雰囲気では Ce<sup>3+</sup>となって酸素を放出し,排 ガス中の酸素濃度を一定に保つはたらきを持つためであ る。しかしながら酸化セリウムは耐熱性が低いため,他 元素添加による複合酸化物化などにより耐熱性向上が図 られている。

透過電子顕微鏡(以下,TEM)の分析機能の1つで ある電子エネルギー損失分光(以下,EELS)はX線吸 収微細構造(以下,XAFS)におけるX線吸収端近傍構 造(以下,XANES)に対応したスペクトルを得て,価 数や化学状態を解析する測定手法である。EELSは XAFSとは異なりSpring8のような大規模放射光源を利 用する必要がなく,1nm前後の微小領域でも測定可能 で,同時に結晶・アモルファス構造に対応したTEMの 高分解能像と電子回折像を測定できるといった優れた特徴がある。

自動車用触媒の EELS 解析では,これまでに荒井, 武藤ら<sup>1,2)</sup>がセリウム-ジルコニウム酸化物系において, セリウムの中間的な価数の存在を確認している。本研究 では酸化セリウムにネオジウムを添加したセリウム-ネ オジウム酸化物系での,大気中加熱による状態変化の EELS スペクトルの解析例を報告する。

## 2 実験方法

#### 2.1 試料作製

セリウム・ネオジウム酸化物 Ce<sub>1-x</sub>Nd<sub>x</sub>O<sub>y</sub> (x=0, 0.1, 0.3, 0.5)は共沈法によって,硝酸セリウム及び硝酸ネ オジウムから合成し,乾燥の後,大気中 600 2 時間の 焼成処理を行った。これらをもとに大気中 800 及び 1,000 2 時間の加熱処理を行い,未処理(以下, fresh)の試料を加えて各組成3 種類の試料を作製した。 本報告ではネオジウム添加の効果が明瞭で,分相が生じ ていない x=0.3 のネオジウム添加試料と x=0 の酸化セリ ウム単独の試料を比較検討した。

TEM 用薄片試料は,酸化物微粉末を少量のアセトン とともにバイアル瓶に入れ,超音波洗浄器で分散させた 後,銅製メッシュで支持膜のない応研商事㈱マイクログ リッドタイプA(特製品)に滴下し,作製した。

\*マツダ株式会社技術研究所

#### 2.2 観察・測定方法

TEM 観察及び EELS 測定には 90°ポストカラム型 エネルギーフィルター (Gatan 社 GIF-2000)を装備し た日本電子㈱製 JEM-3000F ショットキー型静電界放射 透過電子顕微鏡 (加速電圧 297kV)を使用した。EELS スペクトルのエネルギー分解能はゼロロスピークの半価 幅の実測値で 1.1~1.2eV,像の格子分解能は 0.1nm, 制限視野電子回折のカメラ定数は 1.97cm・ であった。



図1 各試料の低倍 TEM 像(左,直接倍率 25,000 倍) とゼロロス像(右,エネルギースリット幅 E=10 eV)

観察時の電子線照射による EELS スペクトルの変化 を防ぐため,電子線の照射量を低減し,EELS 測定は高 分解能観察を始めとするその他すべての観察測定の前に 行った。また,各スペクトルは個別の測定位置でゼロロ スピークを基準に校正した。

なお,本文中の図 1~3 に使用した TEM 像,制限視 野電子回折及び EELS スペクトルは,いずれもほぼ同 一位置から得られたものである。

## 3 結果及び考察

#### 3.1 TEM 観察

図 1 に各試料の典型的な直接倍率 2 万 5 千倍の低倍 TEM 像とゼロロス像を示した。ゼロロス像はポストカ ラム型エネルギーフィルターを利用し,エネルギー幅 E=10eV のエネルギースリットによって非弾性散乱電子 を除去した高分解能像で,低倍 TEM 像の中央付近を約 14 倍に拡大したものである。

低倍 TEM 像から x=0 の酸化セリウム単体試料の粒子 サイズが, x=0.3 のネオジウム添加試料より大きいこと が分かる。また,両組成とも 800 で形態が変化し, 1,000 で粒子サイズが成長していることが分かる。ま た,ゼロロス像から x=0 では加熱によって結晶性が高く なり, x=0.3 では加熱による結晶成長していることが分 かる。

#### 3.2 制限視野電子回折

図 2 に各試料の制限視野電子回折像を示した。いずれ も同一直径の制限視野絞りを使用しており,回折に寄与 した試料面積はほぼ同じと考えられる。

酸化セリウム単体の x=0 fresh では回折スポットが広 がるとともに,デバイシェラー環が見られている。これ は試料が厚く,結晶性が低いことを示している。800 では明瞭な回折スポットが多くなり,1,000 では減少 している。このことは加熱による結晶性の向上と結晶成 長を示している。

ネオジウム添加した x=0.3 は一様に明瞭な回折スポットが見られ, fresh,800,1,000の順に回折スポットが減少している。このことは加熱による結晶成長を示している。

また,回折スポットの解析によって,すべての試料が 格子定数 5.4~5.5 の立方晶であることが確認された。

## 3.3 EELS スペクトル解析

図 3 に各試料の O-K Edge 近傍の,図4に Ce-M Edge 近傍の EELS スペクトルを示した。各スペクトル







はグラフ範囲内最高のピークトップ強度を基準に規格化 している。

図 3 の O-K Edge には a, b, c の記号を付けた 530, 532,536eV の 3 つのピークがある。酸化セリウム単体 の x=0 では加熱によってピーク a が増加し,ピーク b が減少している。ネオジウム添加した x=0.3 ではピーク a, b, c の強度関係及び形態に変化は見られない。また, すべての試料でエネルギーシフトは確認できなかった。



図 4 の Ce-M Edge には  $M_5$ ,  $M_4$  ピークとともに, 各 ピークから 6eV高エネルギー側に d, e の記号を付けた ピークが存在する。各スペクトルは酸化セリウム単体未 処理の x=0 fresh 以外は,顕著な差異がない。x=0 fresh は他のスペクトルに比べて各ピークの中心が 3eV 低エ ネルギー側に存在するとともに,ピーク自体が広がって いる。このエネルギーシフトから酸化セリウム単体未処 理の試料が 3 価,その他の試料が 4 価であると考えられ る。

図 5 に木本,石塚 <sup>3,4)</sup>が開発した DeConvoEELS ソフ トウェアによる x=0 fresh の Ce-M Edge のピーク分離 例を示した。試料を透過した電子にはゼロロスピークを 作る透過及び弾性散乱成分とともに,その 10~100 分 の 1 の強度のプラズモンと呼ばれる価電子に関連した非 弾性散乱成分が含まれる。プラズモンは厚さに比例して 増加し, EELS スペクトルのエネルギー分解能を低下さ せる。同ソフトウェアでは同一条件・同一位置でゼロロ スからプラズモンにかけてのスペクトルを測定し,プラ ズモンを始めとするノイズ成分を計算に組み込んで本来 のスペクトルを再現する。(1)は生データ,(2)は単純に プラズモンの効果を組み込んだスペクトル,(3)は Richardson –Lucy 法(以下,RLA)によるピーク分離 例,(4)は Maximum Entropy 法(以下,MEM)による ピーク分離例を示している。本スペクトルの場合 MEM によるピーク分離がもっとも良好で,M5 ピークが 882 と 884eV に,M4 ピークが 900 と 902eV に分離した。 このことは酸化セリウム単体未処理の試料に 2 つの価数 が存在する可能性を示唆している。<sup>5)</sup>



Energy Loss, E/eV

図 5 ピーク分離を行った x=0 fresh の Ce-M Edge EELS スペクトル

各 EELS スペクトルは酸化セリウム単体の試料では 800 の加熱によって化学状態の顕著な変化があるのに 対し,ネオジウム添加された試料では有意な変化が認め られないことを示唆している。

## 4 結 言

TEM 及び EELS によるセリウム - ネオジウム系酸化物の解析結果は以下の通りまとめられる。

(1)加熱によって酸化セリウム単体の試料では結晶性の向上と結晶成長が,ネオジウム添加した試料では結晶成長が生じる。

(2)酸化セリウム単体の試料では 800 の加熱によって化 学状態が顕著に変化するが,ネオジウム添加された試料 では 1,000 の加熱でも有意な変化は確認できない。 (3)未加熱の酸化セリウムは 2 種類の価数を持つ結晶が 混合されている可能性がある。

(1)は通常の TEM 観察である低倍 TEM 像,高分解能 像及び制限視野電子回折像からの,(2)及び(3)は EELS スペクトル解析から得られた結論である。本報告では各 試料の典型的な EELS スペクトルの比較を目的に,多 数の結晶が存在する数 10nm の領域の EELS スペクト ルを測定したが,個別の結晶毎の EELS スペクトル測 定も可能である。EELS は nm オーダーの領域の価数や 化学状態の解析が可能な唯一の手段であり,典型元素<sup>(6)</sup>, <sup>22</sup>Ti ~ <sup>29</sup>Cu の遷移金属及びランタノイドに対して有効性 が高い。自動車用触媒に限らず触媒材料全般,結晶学的 な手法での解析が困難なアモルファス等の状態解析に広 く応用できる。

## 文 献

1)荒井他:日本金属学会誌, 68(2004), 264-268 2)Arai et al: Solid State Communications 135(2005), 664-667

3)Kimoto et al : J. Microscopy , 208(2002) , 224-228 4)石塚:顕微鏡 , 39(2004) , 204-206

5)Tanabe et al : Proc. IMC16 in printing

6)田辺他:日本金属学会誌, 69(2005), 113-120